

APEX 2019: Neuheiten aus der Welt des Testens

Digitaltest stellt aus: 26.-31. Januar, Stand 3533

Wer bestückte Leiterplatten testet, sollte den Digitaltest-Stand auf der Apex 2019 besuchen. Digitaltest stellt hier das umfassende Spektrum an automatisierten Testsystemen sowie verschiedene Softwarelösungen für die Elektronikfertigung vor. Unter anderem eine neue App für Fehlerbilder, welche die Reparatur erheblich erleichtert sowie eine Technologie, die die Testzeit um ein Vielfaches verkürzt.

Besuchen Sie Digitaltest vom 26.-31. Januar 2019 auf der IPC APEX EXPO in San Diego, Kalifornien, am Stand 3533.

Neue Applikation zur Reparaturunterstützung

Ein altes Sprichwort und doch wahr: ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Diesen Satz hatten die Entwickler vom Testsystemhersteller Digitaltest im Kopf, als sie den Fault Image Browser programmierten. Hierbei macht eine über den PC angeschlossene Kamera Bilder von gefundenen Fehlern. So können Fotos von beispielsweise Bestückfehlern, defekten Bauteilen oder erfolgreichen Reparaturen aufgenommen, gespeichert und ausgewertet werden. Diese App ist Teil der **Paperless Repair Software QMAN** von Digitaltest. Sie hilft allen gängigen Testsystemen, schneller zu reparieren und den Fertigungsprozess zu beobachten sowie auszuwerten.

Gerade im Lohntest kann diese QMAN-Funktion den Kunden helfen, erkannte Fehler besser zu visualisieren. Selbstverständlich unterstützt ein Fehlerbild auch bei der Reparatur und ermöglicht es, die erfolgreiche Ausbesserung fotografisch festzuhalten.

Paralleltest reduziert die Testzeit um ein Vielfaches

Der Nutzentest ist in der Elektronikfertigung nicht mehr wegzudenken – die Vorzüge liegen auf der Hand: es können selbst kleinste Baugruppen getestet werden und der Nutzentest ermöglicht höhere Stückzahlen in kürzerer Zeit bei optimiertem Ressourceneinsatz. Soll das Testsystem nun anstatt einer Einzelschaltung beispielsweise einen Achtfach-Nutzen prüfen, benötigt dies innerhalb der Produktionslinie jedoch mehr Zeit – es könnte zu einem Stau kommen. Hier kann der Paralleltest die Testzeit soweit verringern, dass der Nutzentest in die Taktzeit der Linie passt. Mit der **Paralleltechnik von Digitaltest, der Lambda edition**, werden die Einzelschaltungen auf dem Mehrfachnutzen gleichzeitig getestet und so die Tests auf dem schnellsten Weg durchgeführt. Dies funktioniert, indem ein In-Circuit-Test oder Funktionstest von zwei oder mehr unabhängigen Testköpfen ausgeführt und dadurch die Prüfzeit um den entsprechenden Faktor reduziert wird.

Fortschrittliche CAD-Übersetzungslösungen: C-LINK DTM

Die CAD/CAM-Software von Digitaltest C-LINK DTM automatisiert die Übersetzung der Konstruktionsdaten vom CAD-System zu nahezu allen auf dem Markt vorhandenen Testsystemen. Durch die Verbindung von Design to Test mit der Produktion werden Rentabilität und Produktqualität gesteigert, Testkosten reduziert sowie Test- und Produkteinführungszeiten verkürzt.

Be multifunctional: der Vacuum-Tester Sigma MTS 300

Messebesucher können sich am Digitaltest-Stand live ein Bild von einem der schnellsten In-Circuit-Testern auf dem Markt machen. Der Sigma MTS 300 ist für eine hohe Durchlaufleistung konstruiert worden und führt bis zu 1.000 Messungen pro Sekunde durch. Das Testsystem prüft bestückte Leiterplatten mit bis zu 3.456 analogen, 1.664 hybriden oder ein Mix aus beiden Testpunkten. Der Sigma stellt Flexibilität, eine hohe Fehlerabdeckung und einfache Programmierung in den Vordergrund. Dank der nicht gemultiplexten Pinarchitektur es zudem möglich, vorhandene Adapter und Prüfprogramme von anderen Testsystemen zu übernehmen.

Be universal: der Flying Probe Tester Condor MTS 505

Auch der für alle Teststrategien einsetzbare Flying Prober Condor stellt Digitaltest auf der Apex Show aus. Dank der vier beweglichen Testköpfe bietet er eine hohe Adaptationstiefe und Testabdeckung. Durch den optionalen Einsatz von Fix-Testpins an der Unterseite des Prüflings, können zusätzlich die Testzeit verringert und die Testabdeckung erhöht werden. Der Condor ist mit einer hochmodernen Farbkamera (CMOS) ausgestattet, um die Prüflingsposition und die Landeposition der Nadel exakt zu bestimmen. Das Flying Probe System ist sowohl als In-Line-Tester sowie als Frontloader (manuelles Beladen) einsetzbar.

IPC APEX EXPO 2019

26.-31. Januar 2019

San Diego, Convention Center

Kalifornien, USA

Digitaltest-Stand 3533

Über Digitaltest

Als starker Partner der Elektronikindustrie entwickelt und produziert Digitaltest automatisierte Testsysteme (ATE) für elektronische Leiterplatten, Software für die Automatisierung der Produktion und Qualitätsmanagement-Systeme. Digitaltest steht für innovative Lösungen zur Optimierung des gesamten Herstellungsprozesses – als Schnittstelle zwischen CAD, den Testverfahren und der Produktion selbst. Digitaltest bietet zusätzlich umfassenden Service und Support, bis hin zum kompletten Outsourcing von Leiterplattentests an Standorten weltweit.

Über 35 Jahre Spitzentechnologie, Zuverlässigkeit und Werthaltigkeit in Sachen automatisierte Testsysteme.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Sarah Boctor-Vauvert

Geschäftsführerin

E-Mail: sarah.boctor-vauvert@digitaltest.com

Telefon: +49 (7244) 96 40-24

Digitaltest GmbH

Lorenzstraße 3

76297 Stutensee

Deutschland

www.digitaltest.com